高濃度のKFを添加したチタン酸バリウム単結晶の育成と誘電特性

平木勇太*·秋重幸邦**

Yuuta HIRAKI and Yukikuni AKISHIGE Crystal Growth of High-density KF-doped Barium Titanate and the Dielectric Properties

ABSTRACT

We succeeded in growing the KF-doped BaTiO₃ single-crystals by changing the molar ratios of the liquidsolution consisting of KF: BaO: TiO₂ = 10: 1: 1+ α where is a variable in a range up to 1.2. The content x in the chemical formula, Ba_{1-x}K_xTiO_{3-x}F_x, was evaluated by using an electron-probe micro-analyzer: x changes continuously to approximately 0.10 as α increases to 1.0. Temperature dependence of the dielectric constant was measured using these crystals with different x. The ferroelectric Curie-temperature T_C decreases monotonously from 390 K to 280 K with increasing α from 0 to 1.2, while the maximum value of the dielectric constant ε_{max} at T_C exhibits a peak around $\alpha = 1.0$.

> 【キーワード:チタン酸バリウム, KF添加, 結晶育成, フラックス法, 誘電率】 【Keywords: BaTiO₃, KF-doped, Crystal growth, Flux-method, Dielectric constant】

1. はじめに

近年, 産業界では環境問題への関心の高まりから鉛な どの有害物質を含まない材料への代替が世界的に重要な 課題になっている. 圧電体材料の分野においても, 環境に 無害で, 室温でより高い圧電特性をもつ非鉛系圧電材料 の開発が盛んに行われている. しかし, これまで多く使わ れてきたPZT(PbZrO₃とPbTiO₃の混晶)のような鉛系 材料を超える材料はまだ見つかっておらず, その代替は 今も困難な状況にある[1].

本研究室では、鉛系圧電体に替わる材料としてBaTiO₃ に注目し研究を行ってきた[2]. BaTiO₃は、ペロブスカイト 構造をもち、極めて高い比誘電率をもつことが知られて いる. 1940年代に発見されて以来、コンデンサやサーミス タ等の誘電体材料として広く用いられている代表的な電 子材料である.現在ではBaTiO₃をベースとして化学組成 の部分置換による新規材料の開発が多くの研究者によっ て行われている.実際に、アルカリ希土類金属や希土類金 属などを少量添加し結晶の構造制御を行い、強誘電キュ リー温度T_Cを変化させることで、誘電率 ε を調節できる ことが知られており、実用化もされている.

本研究室の道家・大西らは、KFフラックス法による BaTiO₃単結晶育成を行い、結晶中へのKFの混入と物 性の関係を詳しく調べた[3, 4]. 10%近くKFが混入した BaTiO₃においては、T_Cが308Kと低く、誘電率が約11000と 大きく、常温における圧電定数d₃₃も300 C/Nと優れたも のであることを見出した.しかし、道家は0~3%までの KF添加、大西は10%だけのKF添加であった.

本研究では、KFフラックス法による $Ba_{1-x}K_xTiO_{3-x}F_x$ 単結晶の広い濃度範囲での育成法を確立し、KF添加量と T_C

** 島根大学教育学部自然環境教育講座

及び ε の温度依存を明らかにすることを目指す.

2. 実験方法

2.1. 結晶育成

結晶育成は, KFを溶媒に用いたフラックス法で行った.フラックス法による単結晶育成の流れを図1に示す.



図1 フラックス法による単結晶育成の手順

原料粉末にはBaCO₃(関東化学99.9%)とTiO₂ (ARDRICH 99.8%)を使用した.これらの試薬をモル 比1:(1+ α)で混ぜ合わせ溶質とした.TiO₂を α だけ過 剰に仕込む理由は,KF溶液中のTiの割合を増やすこと でBaが不足し,結晶成長の際にBaサイトにKを取り込ま せることができると考えたためである.実際に結晶育成 に用いた試薬の量を表1にまとめる.

原料粉末の調整には、粉砕装置(アズワン社製 MMPD-M1)を用い、粉末が均等になるように2時間粉

^{*} 島根大学大学院教育学研究科教科教育専攻

番号	仕込み量α	BaCO ₃	${ m TiO}_2(1+lpha)$
1	0.5	0.05 mol	0.075 mol
		9.867 g	4.3575 g
2	0.7	0.05 mol	0.085 mol
		9.867 g	4.9385 g
3	0.9	0.05 mol	0.095 mol
		9.867 g	5.5199 g
4	1.0	0.05 mol	0.1 mol
		9.867 g	5.81 g
5	1.2	0.05 mol	0.11 mol
		9.867 g	6.391 g

表1 測定に用いた試薬

砕混合した.

この粉末をアルミナ坩堝に移し縦型電気炉で800℃・8 時間仮焼し, 二酸化炭素を取り除く. 原料粉末のBaに対し てKF(関東化学99%)をモル比1:10の割合で加え, 粉 砕装置で2時間粉砕混合する. なお, ここで用いるKFは 潮解しやすく正確に計量することが難しいため, あらか じめ48時間200℃で乾燥させてから計量している.

結晶育成の指標となるBaTiO₃のKF中での溶解度曲線 を図2に示す.結晶育成には図3に示した縦型電気炉を 使用した.アルミナ坩堝に白金坩堝を入れ,その隙間にア ルミナセメントを敷き詰めた.白金坩堝にKFと原料の混 合粉末を入れる.粉末はムラのないように表面が平らに なるように均す.これを縦型電気炉の中央部に火バサミ を使って設置する.このとき,白金坩堝の底の付近に熱電 対が来るように設置場所を調整する.また,炉内は筒状に なっているため均等に熱が伝わるように筒の中央に坩堝 が来るように注意する.

結晶育成は、条件の異なる2つの温度プログラム(図 4)を用いて行った、条件①では、8時間かけて1073℃ま で加熱し、4時間定置後、616℃まで10時間で降温させる ように設定した.条件②では、1073℃まで12時間かけて加 熱し、4時間定置後、786℃まで30時間かけて降温させる 設定である、プログラム終了後は、条件①②ともに炉冷し た.

坩堝が常温まで下がったら電気炉から取り出し,固 まったKFと結晶化しなかったBaO・TiO₂を水で流して 結晶を回収する.固まったKFの中から結晶を取り出そう とすると,結晶が壊れてしまう場合があるので,溶融固化 物を水につけて柔らかくなるのを待ってから回収する. 結晶は小さく,強い力で掴むと壊れてしまい回収しにく い.先の細いピンセットや竹串を用いて慎重に取り出す.

2.2. 誘電率測定

誘電率測定の流れを図5に示す.回収した結晶の中か ら,比較的広い(100)面の出ている結晶を誘電率測定用 試料として選んだ.この時,ひびの入った結晶や内部が空 洞になっている結晶では誘電率に影響がでるので避ける. 試料の固定のために図6に示した研磨用冶具を製作した. 図6最下部の円盤の下面にクリスタルボンドで試料を固 定した.試料の研磨は電動研磨機(ユニオン光学株式会



図2 BaTiO₃のKF中での溶解度曲線[5]





③ 試料に電極とリード線の取り付け

④ 電極の焼き付け ⑤ 電極面積の測定 ⑥ 誘電率の測定

図5 単結晶の誘電率測定の流れ

社GP-1)を用いて行った.研磨には丸本ストルアスの耐 水研磨紙(#800→#1000→#1200→#1500)を用いた. 結晶の水平な面が出たら,反対の面も同様に磨き,結晶が 平行平板になるまで研磨した.

研磨した試料は、ダイヤルゲージを使って厚さを計り、 傾いていないか確認したうえで、試料の面の厚さを数ヶ 所測って試料の厚さの平均を出した.

誘電率測定のための電極には銀ペースト(Dupond No. 7095)を用いる.まず,一方の面に銀ペーストを薄く延ば して塗布する.次に,この面の中央部に,直径0.025mm金線 を取り付けリード線とする.銀ペーストが十分に乾くま で120℃のホットプレートで乾燥させた後,反対側の面 も同様に銀ペーストを塗布し金線を取り付ける.この作 業は,細かい作業のため実体顕微鏡下で行った.また,銀 ペーストを付ける際,側面に銀ペーストが垂れると導通 が起こってしまうため,垂れないように注意する必要が ある.

金線を付けた試料が導通してないか確認できたら, 急速ランプ加熱炉(ULVAC MILA-3000) に入れて, 500℃ で電極の焼き付けを行った.

試料の電極面積は実体顕微鏡下での写真撮影によって 行った.写真をプリントアウトし,OHPシートを試料の電 極部分の輪郭をかたどって切り抜き,その重さを量る.同 様に2mm×2mm(試料の大きさによって変える)の大き さの正方形もかたどって切り抜く.これらのOHPシート の重量比から面積を求めた.

誘電率測定装置の概略図を図7に示す.誘電率測定装 置は、温度制御系、測定系、記録系の装置から構成されて いる.温度制御は、温度コントローラ(CHINO SU10N) で行った.測定系はLCRメータ(Agilent Technologies HP4285A・HP4284A)で、1Vの電圧をかけながらサンプ ルの電気容量と誘電損失を周波数ごとに測定し、デジタ ルマルチメータ(KEITHLEY 2000 MULTIMETER) でサンプルの温度を測定した.記録系はパーソナルコン ピュータ(NEC PC-9801RX)を用いた.Q-BASICのプロ グラムによりLCRメータの値とデジタルマルチメータの 値をフロッピーディスクに記録した.

3. 実験結果

3.1. 育成した結晶

条件①で育成した結晶の写真を図8に示す. 育成した のは $\alpha = 0.5, 0.7, 1.0, 1.20$ 結晶である. このKFフラック ス法で成長させた結晶は、薄い羽のような形や板状の形 をしており、坩堝の底から多数得られた. 結晶の色は仕込 み量 α によって多少の濃淡があるものの全体的に黄色が かっており、光が透過するような結晶も得ることができ た. 仕込み量の値の小さい $\alpha = 0.5, 0.70$ 結晶には羽のよう に薄く三角形をした結晶が多く見られた. しかし、このよ うな結晶は α の値が大きくなるにつれて数が少なくなっ ていく. 逆にサイコロ状の結晶が多く見られるように



図6 研磨用治具



図7 誘電率測定装置の概略図

なった.

次に,条件②で育成した α=0.9の結晶を図9に示す.条件①で焼成した結晶に比べ,条件②では降温速度を遅く した分,明らかに大きくなっていることがわかる.条件① で育成した結晶に見られた薄い羽のような形をした結晶 は見られず,サイコロのような立方体の結晶が多くでき た.また,小さな結晶同士が集まった多結晶体も多く見ら れた.結晶の色は条件を変えても大きな違いは見られな かった.

3.2. EPMA分析

仕込み量ごとの結晶の構成成分を調べるため、株式
会社ハイメックに依頼し、EPMA分析(JEOL JXA-8800M)を行った.その結果を表2に示す.表はTiの存在
比を1として、Ba, K, Fの存在比を示したものである.

この結果,溶液中のTiの割合 αを多くするほど,KとF が結晶中に多く取り込ませることができることがわかっ た.それぞれの仕込み量で,KとFの存在比はほぼ同じ値 を示している.

表2 Tiの割合を1にしたときの結晶の構成成分

仕込み量α	Ba	Κ	Ti	F
0.5	0.898	0.028	1.000	0.025
0.7	0.840	0.073	1.000	0.069
1.0	0.890	0.100	1.000	0.130

3.3. 誘電率測定

図10に仕込み量ごとにプロットした誘電率の温度依存 性を示す.誘電率は,高温側から,立方晶-正方晶転移の 強誘電キュリー温度T_Cで最大を示し,次の正方晶-斜方 晶転移で2番目に大きなピークを示し,最後の斜方晶-



図8 条件①で育成した結晶(1メモリ1mm)



図9 条件②で育成した結晶(1メモリ1mm)

菱面体晶転移で瘤を示している. 仕込み量 α の値が大き くなるにつれて T_c が下がっている. また, T_c における誘 電率の最大値 ε_{max} に注目すると, α =1.0の時, 最も大き くなっている. その値は ε_{max} =11000 (T_c =308K) であ る.

図11は、今回作成した全ての試料について、仕込み量 α とT_Cの相関を示したものである.なお、 $\alpha = 0, 0.05, 0.3$ は 過去のデータである[3]. $\alpha = 0$ に比べて、 $\alpha = 1.2$ では100 K以上T_Cが下がっていることがわかる.また、仕込み量 α の値を大きくすることで、ほぼ直線的にT_Cが下がってい くことがわかった.

図12は、横軸にT_C、縦軸に誘電率の最大値(T_Cでの誘 電率)をプロットしたものである.誘電率の最大値は α に比例して減少していくが、 α =1.0付近で跳ね上がり最 大になる.その後、減少に転じている.また、同じ仕込み量 であっても、実際に混入しているKFの量の違いを反映し て、T_Cや誘電率の最大値にばらつきが見られる.

4. 考察

結晶の形状は, α の値が大きくなるにつれて,薄い羽や 板状の結晶が少なくなり,サイコロ状の結晶が多くなっ ていく.また,降温速度を遅くすることで,結晶成長が進 み,大きな結晶が得られるようになっている.しかし,こ の方法では,結晶同士が重なり合った多結晶体が出現し やすい.このため今回採用した徐冷法のように結晶を析 出させる方法ではなく,トップシード法などの種結晶を 溶液の中で成長させる方法を用いると,単結晶の巨大化 を図ることができると思われる.

EPMA分析からは、カリウムとフッ素が同程度入って いる事がわかった. 電荷のバランスを考えると、KF添加 チタン酸バリウムの化学式は $Ba_{1,x}K_xTiO_{3,x}F_x$ の式が成り 立っていると思われる.

住込み量ごとに誘電率の温度依存性を調べた結果, KF を添加させることによって, 直線的に大幅に T_c が下がる ことが分かった.また, 仕込み量 α が1.0付近で, 誘電率が 最大になることが明らかになった.しかし, 同じ仕込み量 で育成した結晶であっても, 誘電率や T_c の値にばらつき が見られた.これは結晶育成の際, 先にできた結晶と後 にできた結晶とではKFの混入量が異なっているためで あると思われる.フラックスを直接取り込ませる方法を とったため, 溶液中のKF量は, 結晶成長の進行に伴い少 なくなるために, このような結果になったと考えられる.

5. まとめ

今回, KFフラックス法でBaTiO₃単結晶を育成し, 仕込 み量を変えることで, KFの添加量を制御した高濃度のK を添加したBaTiO₃単結晶を育成することに成功した.ま た, 仕込み量と誘電率との相関及び仕込み量とキュリー 温度の関係が明らかになった.

今後は、トップシード法を用い単結晶の大型化を図り,圧 電定数d₃₃・d₃₁や自発分極などを測定し、さらに細かく物 性を明らかにしていく予定である.



図10 誘電率の温度依存の仕込み量による違い



参考文献

- 和田智志 鶴見敬章: "ドメイン制御による非鉛系圧電 体結晶の性能向上"セラミックス,40, No.8 (2005) pp. 598-603.
- [2] 秋重幸邦: "六方晶チタン酸バリウムの逐次相転移"固 体物理, 26, No. 8(1991)pp. 471-482.
- [3] Y. Akishige, T.Michile and T. Tsunogae: "Ferroerectric Curie Temperature of BaTiO₃ Single Crystals Grown by A Flux Method" Ferroelectrics, 269 (2002) pp. 249-254.
- [4] Y. Akishige: "Ferroelectric and Piezoelectric Properties of Single Crystals of Ba_{1-x}K_xTiO_{3-x}F_x with x=0.1" J. Phys. Soc. Jpn., 75 (2003) pp. 073704 i-iii.
- [5] C. Karan and B. J. Skinner: "BaTiO₃-KF Phase Diagram" J. Chem. Phys., 21 (1953) pp. 2225.